

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome
United States Patent and Trademark Of[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer](#) [Quick Links](#)

→ Se

[Review](#)[Welcome to IEEE Xplore](#)

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

[Tables of Contents](#)

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

[Search](#)

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

[Member Services](#)

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)
- [Access the IEEE Member Digital Library](#)

[Print Format](#)Your search matched **32** of **983096** documents.

A maximum of **32** results are displayed, **15** to a page, sorted by **Relevance in descending** order. You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one the text Then click **Search Again**.

[Search Again](#)**Results:**Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****31 Scalable feature mining for sequential data***Lesh, N.; Zaki, M.J.; Oglhara, M.;*

Intelligent Systems, IEEE [see also IEEE Expert] , Volume: 15 Issue: 2 , March-2000

Page(s): 48 -56

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(136 KB\)\]](#) **IEEE JNL****32 An active learning framework for content-based information retrieval***Cha Zhang; Tsuhan Chen;*

Multimedia, IEEE Transactions on , Volume: 4 Issue: 2 , June 2002

Page(s): 260 -268

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(279 KB\)\]](#) **IEEE JNL**[\[Prev\]](#) [1](#) [2](#) [3](#)[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved